ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА"

СОГЛАСОВАНО Зав. выпускающей кафедры **УТВЕРЖДАЮ**

Физические основы технологии производства приборов и устройств электроники

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Промышленной электроники

Учебный план 11.04.04 25 00.plx

11.04.04 Электроника и наноэлектроника

Квалификация магистр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
Недель	1	10		
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ
Лекции	10	10	10	10
Лабораторные	10	10	10	10
Практические	10	10	10	10
Иная контактная работа	0,25	0,25	0,25	0,25
Итого ауд.	30,25	30,25	30,25	30,25
Контактная работа	30,25	30,25	30,25	30,25
Сам. работа	69	69	69	69
Часы на контроль	8,75	8,75	8,75	8,75
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

к.т.н., доц., Грачев Евгений Юрьевич

Рабочая программа дисциплины

Физические основы технологии производства приборов и устройств электроники

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

ФГОС ВО - магистратура по направлению подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника (приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 г. № 959)

составлена на основании учебного плана:

11.04.04 Электроника и наноэлектроника

утвержденного учёным советом вуза от 28.02.2025 протокол № 8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Промышленной электроники

Протокол от 22.05.2025 г. № 11 Срок действия программы: 2025-2029 уч.г. Зав. кафедрой Круглов Сергей Александрович

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры Промышленной электроники Протокол от _____2026 г. № ___ Зав. кафедрой Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры Промышленной электроники Протокол от __ _____2027 г. № ___ Зав. кафедрой Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры Промышленной электроники Протокол от ____ 2028 г. № ___ Зав. кафедрой _____ Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2029-2030 учебном году на заседании кафедры

Промышленной электроники

Протокол от	2029 г. №
Зав. кафедрой	
эав. кафедрои	

2020 10

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 «Физические основы технологии производства приборов и устройств электроники» является формирование у студентов твердых теоретических знаний и практических навыков в области технологии производства приборов и устройств электроники.

	2. МЕСТО ДИСЦИ	ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ					
Ц	Цикл (раздел) ОП:	Б1.В.ДВ.02					
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:						
2.1.1	Защита и коммерциализ	ация интеллектуальной собственности					
2.1.2	Методы исследования со	остава вещества					
2.1.3	Силовая электроника						
2.1.4	Электрические приводы	мехатронных и промышленных устройств					
2.1.5	Энергоэффективные спо	особы охлаждения мощных электронных приборов и устройств					
2.1.6	Методы исследования со	остава и структуры поверхности					
2.1.7	7 Методы исследования состава и структуры поверхности						
2.2	Дисциплины (модули) предшествующее:	и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как					
2.2.1	Выполнение и защита вы	ыпускной квалификационной работы					
2.2.2	Преддипломная практик	ra					

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен проводить анализ и выбор перспективных технологических процессов и оборудования производства приборов, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

ПК-1.1. Проводит сравнение характеристик и параметров существующих материалов, технологических процессов и оборудования с характеристиками и параметрами перспективных материалов, технологических процессов и оборудования производства приборов, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

Знать

современные материалы и технологии, применяемые в устройствах микро и наноэлектроники различного назначения Уметь

выполнять сравнительный анализ современных материалов, технологических процессов и оборудования применяемых на производствах устройств микро и наноэлектроники

Владеть

современными средствами проектирования электронных приборов и устройств микро и наноэлектроники

ПК-1.2. Собирает и систематизирует информацию о перспективных материалах, технологических процессах и оборудовании, используемых в производстве приборов, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

Зиать

основные аспекты и технологические процессы производства современных материалов и номенклатуру технологического оборудования различного функционального назначения

Уметь

собирать и систематизировать информацию о перспективных материалах, технологических процессах и оборудовании, используемых в производстве приборов, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

Владеть

навыками сбора информации о перспективных материалах, технологических процессах и оборудовании, используемых в производстве приборов, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

ПК-2: Способен формитровать новые направления научных исследований и опытно-конструкторских разработок

ПК-2.1. Проведит анализ новых направлений исследований в соответствующей области знаний

Знать

современное состояние дел в области технологий микро и наноэлектроники

Уметь

собирать и анализировать научную информацию, работать с информационными системами научной информации и базами данных научных публикаций

Владеть

навыками работы с базами данных научных публикаций

ПК-2.2. Проводит обоснование перспектив проведения исследований в соответствующей области знаний

Знать

современное состояние дел в области технологий производства приборов и устройств микро и наноуровня

проводить поиск и сравнительный анализ существующих направлений исследований в заданной предметной области Владеть

навыками работы с базами данных научных публикаций

ПК-3: Способен выполнять работы по проектированию устройств и установок электроники и наноэлектроники

ПК-3.1. Разрабатывает рассписание работы по проектированию устройств и установок электроники и наноэлектроники

Знать

основные этапы работ по проектированию устройств и установок электроники и наноэлектроники

Уметь

проводить планирование и выполнять расчет трудозатрат этапов НИР и НИОКР

Владеть

навыками планирования этапов НИР и НИОКР

ПК-3.2. Проводит обоснование целесообразности проведения разработки устройств и установок электроники и наноэлектроники

Знать

современное состояние дел в области технологий устройств и установок электроники и наноэлектроники Уметь

определять необходимость выполнения НИР/НИОКР для разработки устройств и установок электроники и наноэлектроники Владеть

навыками выполнения НИР и НИОКР в области устройств и установок электроники и наноэлектроники

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	современные материалы и технологии, применяемые в устройствах микро и наноэлектроники различного назначения, основные аспекты и технологические процессы производства современных материалов и номенклатуру технологического оборудования различного функционального назначения, современное состояние дел в области технологий микро и наноэлектроники, основные этапы работ по проектированию устройств и установок электроники и наноэлектроники, современное состояние дел в области технологий устройств и установок электроники и наноэлектроники.
3.2	Уметь:
3.2.1	выполнять сравнительный анализ современных материалов, технологических процессов и оборудования применяемых на производствах устройств микро и наноэлектроники, собирать и систематизировать информацию о перспективных материалах, технологических процессах и оборудовании, используемых в производстве приборов, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, собирать и анализировать научную информацию, работать с информационными системами научной информации и базами данных научных публикаций, проводить поиск и сравнительный анализ существующих направлений исследований в заданной предметной области, проводить планирование и выполнять расчет трудозатрат этапов НИР и НИОКР, определять необходимость выполнения НИР/НИОКР для разработки устройств и установок электроники и наноэлектроники.
3.3	Владеть:
3.3.1	современными средствами проектирования электронных приборов и устройств микро и наноэлектроники, навыками сбора информации о перспективных материалах, технологических процессах и оборудовании, используемых в производстве приборов, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, навыками работы с базами данных научных публикаций, навыками планирования и выполнения НИР и НИОКР в области устройств и установок электроники и наноэлектроники.

	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
Код	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр /	Часов	Компетен-	Литература	Форма	
занятия		Курс		ции		контроля	
	Раздел 1. Физические основы технологии производства приборов и устройств						
	электроники						
1.1	Введение /Тема/	3	0				

1.2	П C	2	1 1	ПИ 1 1 2	пт т пт э	1/
1.2	Предмет дисциплины и ее задачи. Связь	3	1	ПК-1.1-3	Л1.1 Л1.2	Контрольные
	дисциплины с другими разделами			ПК-1.1-У	Л1.3	вопросы
	дисциплинами специальности. /Лек/			ПК-1.1-В	Л1.4Л2.1	
				ПК-1.2-3	Л2.2Л3.1	
				ПК-1.2-У	Л3.3	
				ПК-1.2-В	Э1	
				ПК-2.1-3		
				ПК-2.1-У		
				ПК-2.1-В		
				ПК-2.2-3		
				ПК-2.2-У		
				ПК-2.2-3		
				ПК-2.2-В		
				ПК-3.1-У		
				ПК-3.1-В		
				ПК-3.2-3		
				ПК-3.2-У		
				ПК-3.2-В		
1.3	Технологии производства электронных	3	0			
	средств. Производственный и технологический					
	процессы /Тема/					
1.4	Этапы развития технологии радиоэлектронных	3	2	ПК-1.1-3	Л1.1 Л1.2	Контрольные
1.4	средств. Типы производств. Основные	3	-	ПК-1.1-3	Л1.1 Л1.2	
						вопросы
	определения процессов и операций технологии			ПК-1.1-В	Л1.4Л2.1	
	производства РЭА. Этапы производственного			ПК-1.2-3	Л2.2Л3.1	
	процесса. Средства технологического			ПК-1.2-У	Л3.2 Л3.3	
	оснащения производства РЭА /Лек/			ПК-1.2-В	Э1	
				ПК-2.1-3		
				ПК-2.1-У		
				ПК-2.1-В		
				ПК-2.2-3		
				ПК-2.2-У		
				ПК-2.2-В		
				ПК-2.2-В		
				ПК-3.1-У		
				ПК-3.1-В		
				ПК-3.2-3		
				ПК-3.2-У		
				ПК-3.2-В		
1.5	Этапы развития технологии радиоэлектронных	3	1	ПК-1.1-3	Л1.1 Л1.2	Отчет
	средств. Типы производств. Основные			ПК-1.1-У	Л1.3	
	определения процессов и операций технологии			ПК-1.1-В	Л1.4Л2.1	
	производства РЭА. Этапы производственного			ПК-1.2-3	Л2.2Л3.1	
	процесса. Средства технологического			ПК-1.2-У	ЛЗ.3	
	оснащения производства РЭА /Лаб/			ПК-1.2-У	Э1	
	оснащения производства ГЭА /Лао/] 31	
				ПК-2.1-3		
				ПК-2.1-У		
				ПК-2.1-В		
				ПК-2.2-3		
				ПК-2.2-У		
				ПК-2.2-В		
				ПК-3.1-3		
				ПК-3.1-У		
				ПК-3.1-В		
				ПК-3.1-В		
				ПК-3.2-У		
				ПК-3.2-У		
1		1	1	L TIK-5-2-15	ı	i

1.6	Этапы развития технологии радиоэлектронных средств. Типы производств. Основные определения процессов и операций технологии производства РЭА. Этапы производственного процесса. Средства технологического оснащения производства РЭА /Пр/	3	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.3 Э1	Отчет
1.7	Этапы развития технологии радиоэлектронных средств. Типы производств. Основные определения процессов и операций технологии производства РЭА. Этапы производственного процесса. Средства технологического оснащения производства РЭА /Ср/	3	11	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.1-В ПК-2.2-З ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-З	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.3 Э1	Устный опрос
1.8	Этапы развития технологии радиоэлектронных средств. Типы производств. Основные определения процессов и операций технологии производства РЭА. Этапы производственного процесса. Средства технологического оснащения производства РЭА /Зачёт/	3	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-У ПК-3.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.3 Э1	Вопросы к зачету
1.9	Технология изготовления печатных плат /Тема/	3	0			

1.10	Классификация печатных плат. Материалы для	3	2	ПК-1.1-3	Л1.1 Л1.2	Контрольные
	изготовления печатных плат. Формирование			ПК-1.1-У	Л1.3	вопросы
	рисунка схем: основные технологии.			ПК-1.1-В	Л1.4Л2.1	Bonpo CD
	Сеткографический метод. Материалы сеток.			ПК-1.2-3	Л2.2Л3.1	
	Фотохимический метод. Химическое травление			ПК-1.2-У	ЛЗ.З	
	и металлизация. Технологии химической и			ПК-1.2-3	313.3 31	
					91	
	электрохимической металлизации. Основные			ПК-2.1-3		
	технологические аспекты гальванотехники.			ПК-2.1-У		
	Химическая металлизация /Лек/			ПК-2.1-В		
				ПК-2.2-3		
				ПК-2.2-У		
				ПК-2.2-В		
				ПК-3.1-3		
				ПК-3.1-У		
				ПК-3.1-В		
				ПК-3.2-3		
				ПК-3.2-У		
				ПК-3.2-В		
1.11	Was say have say a sugary war a say Maranya ay a sag	3	1	ПК-1.1-3	Л1.1 Л1.2	Отчет
1.11	Классификация печатных плат. Материалы для	3	1			Orger
	изготовления печатных плат. Формирование			ПК-1.1-У	Л1.3	
	рисунка схем: основные технологии.			ПК-1.1-В	Л1.4Л2.1	
	Сеткографический метод. Материалы сеток.			ПК-1.2-3	Л2.2Л3.1	
	Фотохимический метод. Химическое травление			ПК-1.2-У	Л3.3	
	и металлизация. Технологии химической и			ПК-1.2-В	Э1	
	электрохимической металлизации. Основные			ПК-2.1-3		
	технологические аспекты гальванотехники.			ПК-2.1-У		
	Химическая металлизация /Лаб/			ПК-2.1-В		
				ПК-2.2-3		
				ПК-2.2-У		
				ПК-2.2-В		
				ПК-3.1-3		
				ПК-3.1-У		
				ПК-3.1-В		
				ПК-3.2-3		
				ПК-3.2-У		
		_		ПК-3.2-В		_
1.12	Классификация печатных плат. Материалы для	3	4	ПК-1.1-3	Л1.1 Л1.2	Отчет
	изготовления печатных плат. Формирование			ПК-1.1-У	Л1.3	
	рисунка схем: основные технологии.			ПК-1.1-В	Л1.4Л2.1	
	Сеткографический метод. Материалы сеток.			ПК-1.2-3	Л2.2Л3.1	
	Фотохимический метод. Химическое травление			ПК-1.2-У	Л3.3	
	и металлизация. Технологии химической и			ПК-1.2-В	Э1	
	электрохимической металлизации. Основные			ПК-2.1-3		
	технологические аспекты гальванотехники.			ПК-2.1-У		
	Химическая металлизация /Пр/			ПК-2.1-В		
	r , · · · r			ПК-2.2-3		
				ПК-2.2-У		
				ПК-2.2-В		
				ПК-2.2-В		
				ПК-3.1-3		
				ПК-3.1-В		
				ПК-3.2-3		
				ПК-3.2-У		
				ПК-3.2-В		

1.13	Классификация печатных плат. Материалы для изготовления печатных плат. Формирование рисунка схем: основные технологии. Сеткографический метод. Материалы сеток. Фотохимический метод. Химическое травление и металлизация. Технологии химической и электрохимической металлизации. Основные технологические аспекты гальванотехники. Химическая металлизация /Ср/	3	14	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.3 Э1	Устный опрос
1.14	Классификация печатных плат. Материалы для изготовления печатных плат. Формирование рисунка схем: основные технологии. Сеткографический метод. Материалы сеток. Фотохимический метод. Химическое травление и металлизация. Технологии химической и электрохимической металлизации. Основные технологические аспекты гальванотехники. Химическая металлизация /ИКР/	3	0,25	ПК-3.2-В ПК-1.1-З ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-З ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-З ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-З ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-З ПК-3.1-З ПК-3.1-У ПК-3.2-З ПК-3.2-З ПК-3.2-У ПК-3.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.3 Э1	Вопросы к зачету
1.15	Классификация печатных плат. Материалы для изготовления печатных плат. Формирование рисунка схем: основные технологии. Сеткографический метод. Материалы сеток. Фотохимический метод. Химическое травление и металлизация. Технологии химической и электрохимической металлизации. Основные технологические аспекты гальванотехники. Химическая металлизация /Зачёт/	3	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.3 Э1	Вопросы к зачету
1.16	Технологии сборки и монтажа компонентов на печатных платах /Тема/	3	0			

1.17	Понятие ручной, механизированной и автоматизированной сборки. Подготовка компонентов РЭА к монтажу. Пенное и волновое флюсование выводов. Технологический процесс монтажа компонентов на печатной плате. Основные методы выполнения электрических соединений /Лек/	3	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.2-3 ПК-3.2-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.3 Э1	Контрольные вопросы
1.18	Понятие ручной, механизированной и автоматизированной сборки. Подготовка компонентов РЭА к монтажу. Пенное и волновое флюсование выводов. Технологический процесс монтажа компонентов на печатной плате. Основные методы выполнения электрических соединений /Лаб/	3	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.3 Э1	Отчет
1.19	Понятие ручной, механизированной и автоматизированной сборки. Подготовка компонентов РЭА к монтажу. Пенное и волновое флюсование выводов. Технологический процесс монтажа компонентов на печатной плате. Основные методы выполнения электрических соединений /Пр/	3	1	ПК-3.2-В ПК-1.1-З ПК-1.1-Р ПК-1.1-В ПК-1.2-З ПК-1.2-Р ПК-2.1-З ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.1-В ПК-2.2-З ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-З ПК-3.1-З ПК-3.1-У ПК-3.2-З	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.3 Э1	Отчет

1.20	Понятие ручной, механизированной и автоматизированной сборки. Подготовка компонентов РЭА к монтажу. Пенное и волновое флюсование выводов. Технологический процесс монтажа компонентов на печатной плате. Основные методы выполнения электрических соединений /Ср/	3	14	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.3 Э1	Устный опрос
1.21	Понятие ручной, механизированной и автоматизированной сборки. Подготовка компонентов РЭА к монтажу. Пенное и волновое флюсование выводов. Технологический процесс монтажа компонентов на печатной плате. Основные методы выполнения электрических соединений /Зачёт/	3	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.3 Э1	Вопросы к зачету
1.22	Физико-химические основы пайки и сварки /Тема/	3	0			
1.23	Подготовка поверхности. Активация соединяемых металлов. Взаимодействие металла с припоем. Кристаллизация. Материалы для пайки. Флюсы. Припои. Очистные жидкости. Технология групповой пайки погружением. Пайка волнами припоя. Пайка концентрированными потоками энергии. Инфракрасная пайка. Лазерная пайка. Ультразвуковая сварка. Термокомпресионная сварка. Сварка взрывом /Лек/	3	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-3.1-3 ПК-3.1-3 ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-3 ПК-3.2-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.3 Э1	Контрольные вопросы

1.24	Подготовка поверхности. Активация	3	2	ПК-1.1-3	Л1.1 Л1.2	Отчет
	соединяемых металлов. Взаимодействие			ПК-1.1-У	Л1.3	
	металла с припоем. Кристаллизация.			ПК-1.1-В	Л1.4Л2.1	
	Материалы для пайки. Флюсы. Припои.			ПК-1.2-3	Л2.2Л3.1	
	Очистные жидкости. Технология групповой			ПК-1.2-У	Л3.3	
	пайки погружением. Пайка волнами припоя.			ПК-1.2-В	Э1	
	Пайка концентрированными потоками энергии.			ПК-2.1-3		
	Инфракрасная пайка. Лазерная пайка.			ПК-2.1-У		
	Ультразвуковая сварка. Термокомпресионная			ПК-2.1-В		
	сварка. Сварка взрывом /Лаб/			ПК-2.1-В		
	Сварка. Сварка взрывом / лас/			ПК-2.2-У		
				ПК-2.2-В		
				ПК-2.2-В		
				ПК-3.1-У		
				ПК-3.1-В		
				ПК-3.1-В		
				ПК-3.2-У		
				ПК-3.2-В		
1.25	Подготовка поверхности. Активация	3	2	ПК-1.1-3	Л1.1 Л1.2	Отчет
	соединяемых металлов. Взаимодействие			ПК-1.1-У	Л1.3	
	металла с припоем. Кристаллизация.			ПК-1.1-В	Л1.4Л2.1	
	Материалы для пайки. Флюсы. Припои.			ПК-1.2-3	Л2.2Л3.1	
	Очистные жидкости. Технология групповой			ПК-1.2-У	Л3.3	
	пайки погружением. Пайка волнами припоя.			ПК-1.2-В	Э1	
	Пайка концентрированными потоками энергии.			ПК-2.1-3		
	Инфракрасная пайка. Лазерная пайка.			ПК-2.1-У		
	Ультразвуковая сварка. Термокомпресионная			ПК-2.1-В		
	сварка. Сварка взрывом /Пр/			ПК-2.2-3		
				ПК-2.2-У		
				ПК-2.2-В		
				ПК-3.1-3		
				ПК-3.1-У		
				ПК-3.1-В		
				ПК-3.2-3		
				ПК-3.2-У		
				ПК-3.2-В		
1.26	Подражение допомуществу. Аменурому	3	12	ПК-1.1-3	Л1.1 Л1.2	Устный опрос
1.20	Подготовка поверхности. Активация	3	12			устный опрос
	соединяемых металлов. Взаимодействие			ПК-1.1-У	Л1.3	
	металла с припоем. Кристаллизация.			ПК-1.1-В	Л1.4Л2.1	
	Материалы для пайки. Флюсы. Припои.			ПК-1.2-3	Л2.2Л3.1	
	Очистные жидкости. Технология групповой			ПК-1.2-У	Л3.3	
	пайки погружением. Пайка волнами припоя.			ПК-1.2-В	Э1	
	Пайка концентрированными потоками энергии.			ПК-2.1-3		
	Инфракрасная пайка. Лазерная пайка.			ПК-2.1-У		
	Ультразвуковая сварка. Термокомпресионная			ПК-2.1-В		
	сварка. Сварка взрывом /Ср/			ПК-2.2-3		
				ПК-2.2-У		
				ПК-2.2-В		
				ПК-3.1-3		
				ПК-3.1-У		
				ПК-3.1-В		
				ПК-3.2-3		
				ПК-3.2-У		
				ПК-3.2-В		
L		İ	l		l	

1.27	Подготовка поверхности. Активация соединяемых металлов. Взаимодействие металла с припоем. Кристаллизация. Материалы для пайки. Флюсы. Припои. Очистные жидкости. Технология групповой пайки погружением. Пайка волнами припоя. Пайка концентрированными потоками энергии. Инфракрасная пайка. Лазерная пайка. Ультразвуковая сварка. Термокомпресионная сварка. Сварка взрывом /Зачёт/	3	1	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-У ПК-3.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.3 Э1	Вопросы к зачету
1.28	Современные технологии микро- и наноэлектроники. Нано-технология и наноэлектроника /Тема/	3	0			
1.29	Атомно-слоевое фотонно-индуцированное осаждение. Инструменты нанотехнологии. Формирование микроконтактов. LIGA-технология для создания микросистемной техники. Принципы изготовления рентгеношаблонов. Принципы построения LIGA станции. Электронно-лучевая технология. Молекулярно-лучевая эпитаксия. Эффузионные ячейки. Дифракция быстрых электронов. МОС-гидридная и газофазная эпитаксия. Технологические особенности газофазной эпитаксии. Технологические особенности жидкофазной эпитаксии /Лек/	3	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-В ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-У ПК-3.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.3 Э1	Контрольные вопросы
1.30	Атомно-слоевое фотонно-индуцированное осаждение. Инструменты нанотехнологии. Формирование микроконтактов. LIGA-технология для создания микросистемной техники. Принципы изготовления рентгеношаблонов. Принципы построения LIGA станции. Электронно-лучевая технология. Молекулярно-лучевая эпитаксия. Эффузионные ячейки. Дифракция быстрых электронов. МОС-гидридная и газофазная эпитаксия. Технологические особенности газофазной эпитаксии. Технологические особенности жидкофазной эпитаксии /Лаб/	3	4	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У ПК-1.1-В ПК-1.2-3 ПК-1.2-У ПК-1.2-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.3 Э1	Отчет

1.31	Атомно-слоевое фотонно-индуцированное осаждение. Инструменты нанотехнологии.	3	2	ПК-1.1-3 ПК-1.1-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3	Отчет
	Формирование микроконтактов. LIGA-			ПК-1.1-В	Л1.4Л2.1	
	технология для создания микросистемной			ПК-1.2-3	Л2.2Л3.1	
	техники. Принципы изготовления			ПК-1.2-У	ЛЗ.З	
	рентгеношаблонов. Принципы построения			ПК-1.2-В	313.3 31	
	LIGA станции. Электронно-лучевая			ПК-1.2-В	31	
	технология. Молекулярно-лучевая эпитаксия.			ПК-2.1-У		
	Эффузионные ячейки. Дифракция быстрых			ПК-2.1-В		
	электронов. МОС-гидридная и газофазная			ПК-2.1-В		
	эпитаксия. Технологические особенности			ПК-2.2-У		
	газофазной эпитаксии. Технологические			ПК-2.2-В		
	особенности жидкофазной эпитаксии /Пр/			ПК-3.1-3		
	осоосиности жидкофизион эпитиксин /ттр/			ПК-3.1-У		
				ПК-3.1-В		
				ПК-3.1-В		
				ПК-3.2-У		
				ПК-3.2-В		
1.32	A	3	1.0	ПК-3.2-В	П1 1 П1 2	V×
1.32	Атомно-слоевое фотонно-индуцированное	3	18		Л1.1 Л1.2	Устный опрос
	осаждение. Инструменты нанотехнологии.			ПК-1.1-У	Л1.3	
	Формирование микроконтактов. LIGA-			ПК-1.1-В	Л1.4Л2.1	
	технология для создания микросистемной			ПК-1.2-3	Л2.2Л3.1	
	техники. Принципы изготовления			ПК-1.2-У	Л3.3	
	рентгеношаблонов. Принципы построения			ПК-1.2-В	Э1	
	LIGA станции. Электронно-лучевая			ПК-2.1-3		
	технология. Молекулярно-лучевая эпитаксия.			ПК-2.1-У		
	Эффузионные ячейки. Дифракция быстрых			ПК-2.1-В		
	электронов. МОС-гидридная и газофазная эпитаксия. Технологические особенности			ПК-2.2-3		
				ПК-2.2-У ПК-2.2-В		
	газофазной эпитаксии. Технологические особенности жидкофазной эпитаксии /Cp/			ПК-2.2-В		
	особенности жидкофазной эпитаксии /Ср/			ПК-3.1-3		
				ПК-3.1-В		
				ПК-3.2-3		
				ПК-3.2-У		
				ПК-3.2-В		
.33	Атомно-слоевое фотонно-индуцированное	3	1,75	ПК-1.1-3	Л1.1 Л1.2	Вопросы к
	осаждение. Инструменты нанотехнологии.			ПК-1.1-У	Л1.3	зачету
	Формирование микроконтактов. LIGA-			ПК-1.1-В	Л1.4Л2.1	
	технология для создания микросистемной			ПК-1.2-3	Л2.2Л3.1	
	техники. Принципы изготовления			ПК-1.2-У	Л3.3	
	рентгеношаблонов. Принципы построения			ПК-1.2-В	Э1	
	LIGA станции. Электронно-лучевая			ПК-2.1-3		
	технология. Молекулярно-лучевая эпитаксия.			ПК-2.1-У		
	Эффузионные ячейки. Дифракция быстрых			ПК-2.1-В		
	электронов. МОС-гидридная и газофазная			ПК-2.2-3		
	эпитаксия. Технологические особенности			ПК-2.2-У		
	газофазной эпитаксии. Технологические			ПК-2.2-В		
	особенности жидкофазной эпитаксии /Зачёт/			ПК-3.1-3		
				ПК-3.1-У		
				ПК-3.1-В		
				ПК-3.2-3		
				ПК-3.2-У		
			1	ПК-3.2-В		l

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название
Л1.1	Каменская А. В.	Основы технологии материалов микроэлектроники : учебнометодическое пособие	Новосибирск: Новосибирски й	ЭБС 978-5-7782- 1420-0, http://www.ip
			государственный технический университет, 2010, 96 с.	rbookshop.ru/ 45129.html
Л1.2	Брусницына Л. А., Степановских Е. И., Марков В. Ф.	Технология изготовления печатных плат : учебное пособие	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015, 200 с.	978-5-7996- 1380-8, http://www.ip rbookshop.ru/ 66137.html
Л1.3	Растворова И. И., Терехов В. Г., Растворова И. И.	Электроника и наноэлектроника : учебное пособие	Санкт- Петербург: Санкт- Петербургски й горный университет, 2016, 205 с.	978-5-94211- 763-4, http://www.ip rbookshop.ru/ 71712.html
Л1.4	Мылов Г.В., Медведев А.М., Дрожжин И.В.	Материалы компонентов радиоэлектронных средств. Печатные платы: учеб. пособие: Учебное пособие	Рязань: КУРС, 2023,	https://elib.rsr eu.ru/ebs/dow nload/3626
	l .	6.1.2. Дополнительная литература		1
No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС
Л2.1	Драгунов В. П., Остертак Д. И.	Микро- и наноэлектроника : учебное пособие	Новосибирск: Новосибирски й государственн ый технический университет, 2012, 38 с.	978-5-7782- 2095-9, http://www.ip rbookshop.ru/ 45107.html
Л2.2	Глущенко А. Г., Глущенко Е. П.	Наноматериалы и нанотехнологии : учебное пособие	Самара: Поволжский государственный университет телекоммуник аций и информатики, 2017, 269 с.	2227-8397, http://www.ip rbookshop.ru/ 75388.html
		6.1.3. Методические разработки		
No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС
Л3.1	Под ред.Ченга Л.,Плога К.;Пер.с англ.под ред.Алферова Т.И.,Шмарцева Ю.В.	Молекулярно-лучевая эпитаксия и гетероструктуры	М.:Мир, 1989, 584c.	5-03-000737- 7, 1
Л3.2	Уточкин Г.В., Петров Е.Ф., Двойнин В.Н.	Элементы микросхем : Метод.указ.к лаб.работам по курсу "Микроэлектроника"	Рязань, 2000, 40c.	, 1

No	Авторы, составители		Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС		
Л3.3	Карабанов С.М., Чижиков А.Е.		атериалов и изделий электронной техники. ектроника : учеб. пособие	Рязань, 2009, 128c.	978-5-7722- 0293-7, 1		
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"							
Э1	Э1 Электронно-библиотечная система «Лань»						
6.3 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем							
	6.3.1 Перечень лице	нзионного и св	ободно распространяемого программного обес	спечения, в том ч	исле		
отечественного производства							
Наименование Описание							
Adobe Acrobat Reader			Свободное ПО				
LibreOffice			Свободное ПО				
MATLAB R2010b			Бессрочно. Matlab License 666252				
	6.3.2 Перечень информационных справочных систем						

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
1	 103 лабораторный корпус. помещение для самостоятельной работы обучающихся, компьютерный класс Специализированная мебель (24 посадочных места), магнитно-маркерная доска. Мультимедиа проектор, 1 экран. ПК. Возможность подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ 214 лабораторный корпус. учебная аудитория для проведения учебных занятий. Специализированная мебель (60 посадочных мест), магнитно-маркерная доска. Мультимедиа проектор, 1 экран. ПК. 					
2						

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	
Методическое обеспечение дисциплины приведено в приложении к рабочей программе дисциплины	

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДПИСАНО ЗАВЕДУЮЩИМ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ

ПОДПИСАНО ЗАВЕДУЮЩИМ КАФЕДРЫ **ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ,** Круглов Сергей Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ

ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Круглов Сергей Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ

13.10.25 17:31 (MSK)

13.10.25 17:31 (MSK)

Простая подпись

Простая подпись